

功能性高分子电容的特性检查 S0022-2022C02

1 台仪器可连续测量聚合体电容、导电性高分子电解电容、导电性高分子钽电容等
低台仪器可连续测量聚合体电容、导电性高分子电解电容、导电性高分子钽电容等
ESR、静电容量。

要点

- 使用阻抗分析仪 IM3570 的 LCR 模式，连续进行 120Hz 下的 C-D 测量，100kHz 下的 ESR 测量。
- ESR 测量使用低阻抗高精度模式。可进行改善后的低阻抗测量反复精度。通过使用 4 端子的接触检查功能（仅开路检查），可实现更加准确的测量。
- 使用比较功能，分别判断 C-D 和 ESR。
- 连续测量中的测量频率的切换等待时间缩短至 1ms，实现高速测量。



■ 测量方法

- 使用面板保存功能，将测量条件保存至面板。（LCR 测量条件最多可设置 30 个）
- 打开低阻抗模式功能。
- 连续测量模式功能下，从面板（测量条件）的列表中选择连续测量的面板。
- 开始测量。



连续测量功能的测量、判断例

使用仪器

阻抗分析仪：IM3570

4 端子探头 L2000

※ 记载的内容是根据 2010 年 7 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在发行的为准。